

クライオ電界放出形走査電子顕微鏡システム

従来の電子顕微鏡は、含水試料や熱に弱い試料の観察が困難である等、観察対象のサンプルについて、様々な制約がありました。

今回は、これらの制約を打ち破る観察手法を可能にした、クライオトランスファーシステムをご案内いたします。

本システムを用いることにより、様々なサンプルを、高品質に観察することが可能です。

日時 2014年2月24日(月) 15:00~16:00

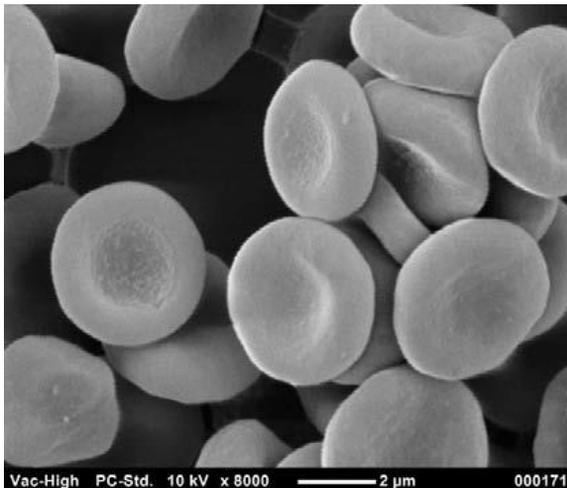
場所 霞総合研究棟 701号室

セミナー内容

- ・クライオ電界放出形走査電子顕微鏡システムの原理
 - ・ご導入いただいたシステム構成
 - ・アプリケーション事例
- *詳細は、別紙プログラムをご参照ください。**



ラットの赤血球



ラットの腎臓の糸球体





JEOL

日本電子株式会社 電子光学機器セミナー

クライオ電界放出形走査電子顕微鏡システム プログラム

会場:

日時:2014年2月24日(月) 15:00 ~16:00

<講演内容>

電子顕微鏡の原理

- ・電子顕微鏡と光学顕微鏡/蛍光顕微鏡の比較
- ・得られる情報(SEM像、二次電子/反射電子、元素分析)

導入機器の構成、特長

- ・FE-SEM
- ・クライオシステム
- ・元素分析

試料作成の注意点

- ・染色方法など
- ・試料取扱上の注意点

ディスカッション

講師:日本電子株式会社 電子光学機器営業本部
参事 小倉 一道